

## BWA-CAM UV BWA Etalon-Optikbaugruppe, 325-425 nm



Produkt #89-716 **NEU** **KONTAKT**

- 1 + €12.420<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1+	€12.420,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

**Modellnummer:**  
BWA-CAM-325-425-R6-EO

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

**Größe (mm):**  
91.0 x 85.0 x 78.0

## Optische Eigenschaften

**Spektralbereich:**  
325 - 425

## Konformität mit Standards

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Echtzeit-Analyse von Laserstrahl-Brennfläche, M<sup>2</sup>, Schwerpunkt, Elliptizität und Astigmatismus
- Kompatibel mit CW- und PulsLasern mit Einzelpuls-Fähigkeit
- Ideal für Laserentwicklung, Qualitätssicherung und die Überwachung optischer Systeme
- Entspricht den Normen ISO 11146 und ISO 13694

Die BWA-CAMM<sup>2</sup> Analysekameras von Haas Laser Technologies bieten Echtzeit-M<sup>2</sup>-Messungen für Dauerstrichlaser und Puls laser in UV-, VIS- oder IR-Wellenlängenkonfigurationen. Mit einer einfachen „Ein-Knopf“-Kalibrierung ist dieses System in der Lage, M<sup>2</sup>-Messungen mit einem einzigen Puls zu liefern, was es ideal für dynamische oder Einzelpuls-Lasersysteme macht. Die BWA-CAM wurde in Übereinstimmung mit den Normen ISO 11146 und ISO 13694 entwickelt und bietet eine präzise Bewertung der kritischen räumlichen Strahlparameter, einschließlich M<sup>2</sup>, Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizität und Astigmatismus. Mit der BWA-CAMM<sup>2</sup> Analysekamera von Haas Laser Technologies kann der Anwender eine Verschlechterung des optischen Systems frühzeitig erkennen und die Abbildungsleistung des Lasers für maximale Qualität und Prozessstabilität optimieren. Das modulare Design der BWA-CAM unterstützt eine breite Palette von Laserwellenlängen und Anwendungsumgebungen. Die hohe Messgenauigkeit und die Datenerfassung in Echtzeit machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für F&E, Fertigung und die Diagnose von Lasersystemen.